

装置利用料金一覧

2025.01-

通常利用

装置名	装置名(略称)	型番	学内利用料金
蒸着装置	CC	JEE-400	無料
走査型電子顕微鏡	SEM-EDS	JSM-IT200	800円/時間
電界放出形走査型電子顕微鏡	FE-SEM-EDS/EBSD	JSM-7100F	1,200円/時間
電子プローブマイクロアナライザー(OMT)	EPMA-OMT	JXA-8800	1,400円/時間
電界放出形電子プローブマイクロアナライザー	FE-EPMA	JXA-8530F	2,000円/時間
波長分散型蛍光X線分析装置	XRF	MagiX PRO	1,700円/時間
卓上X線回折装置	XRD	MiniFlex600	300円/時間
表面電離型質量分析計 ¹	TIMS	MAT262	1,500円/日
誘導結合プラズマ質量分析装置 ²	ICP-MS	X-series	2,000円/試料
初回講習料 ³	全装置	X線関連装置 質量分析装置	上記料金の3時間分 1試料分または1日分

- 1: 表面電離型質量分析計は、消耗品類を全て各自で準備していただきます。
- 2: 溶液化した試料の場合の料金です。それ以外の場合は委託分析となります。
- 3: 利用者の経験に応じて、上記以外に別途講習会を設定させていただく場合があります(別途料金)。

委託分析: 微小領域表面分析

項目	装置名(略称)	型番	委託料金
前処理(炭素蒸着) ¹	CC	JEE-400	1,200円/1回
半定量分析(SEM-EDS)	SEM-EDS	JSM-IT200	2,000円/1試料
	FE-SEM-EDS/EBSD	JSM-7100F	2,500円/1試料
面分析(EDS) (EDS/EBSD)	SEM-EDS	JSM-IT200	1,200円/時間
	FE-SEM-EDS/EBSD	JSM-7100F	1,800円/時間
定量分析 ²	EPMA-OMT	JXA-8800	4,200円/時間

- 1: 導電性のない試料は炭素蒸着の前処理が必要です。場合によっては表面研磨が必要となることがあります(別途料)
- 2: 定量分析で標準試料持ち込みの場合、標準試料の前処理料金が別途加算されることがあります。

委託分析: バルク分析

項目	装置名(略称)	型番	委託料金
粉末試料作成			5,000円/1試料
ガラスビード作成自作 ¹			500円/1試料
ガラスビード作成 + 主成分元素分析 ²	XRF	MagiX PRO	6,000円/1試料
ガラスビード作成 + 微量元素分析 ³			8,500円/1試料
ガラスビード作成 + 主成分元素分析 ² + 微量元素分析			9,000円/1試料
微量元素・希土類元素分析 ⁴	ICP-MS	X-series	10,000円/1試料

- 1: 別途装置使用料(通常利用分)がかかります。
- 2: Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P (酸化物)
- 3: Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Rb, Zn, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, Pb, Th, Ga, La, Ce
- 4: Li, Sc, V, Co, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Pb, Th, U

※蛍光X線分析(XRF)で上記以外の元素分析をご希望される場合は、別途料金がかかります(要相談)。

※バルク分析の前処理作業は、協力講座の実験スペースを借用することになりますので、日程等は前もってご相談願います。

地球惑星固体物質解析システム研究室

運営責任者 栗谷 豪
技術専門職員 松本 亜希子